

中華民國專利公報 (19)(12)

(11)公告編號：299032

(44)中華民國86年(1997)02月21日

新型

全 2 頁

(51) Int. Cl.⁶ : G01B9/02
11/02

(54)名 稱：光學干涉式端對端量測儀

(21)申請案號：85206984

(22)申請日期：中華民國85年(1996)05月09日

(72)創 作 人：

吳見明
楊志宏

新竹市光復路二段三二一號
新竹市光復路二段三二一號

(71)申 請 人：

財團法人工業技術研究院

新竹縣竹東鎮中興路四段一九五號

(74)代 理 人：

1

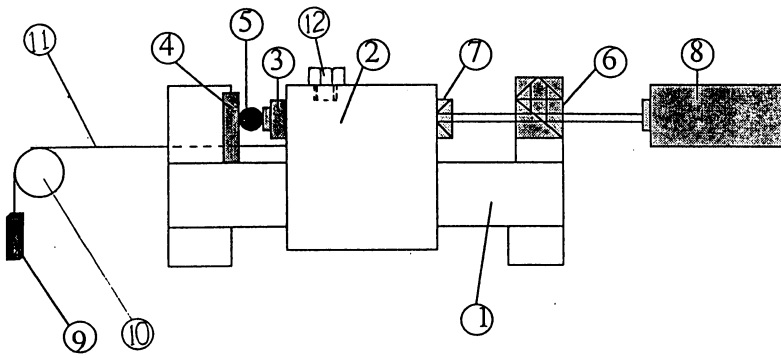
2

[57]申請專利範圍：

1. 一種端對端量測裝置，其包含有：
 - 一滑台；
 - 一承座及其上之滑軌，其中該滑台可在該滑軌上滑動；
 - 一平面探頭，施轉固定於該滑台，並可以其平面砧面與待測物接觸；
 - 一圓柱探頭，固定於該承座，可以其圓柱砧面與待測物接觸；
 - 一組施力裝置，可藉調整施力，對該二探頭施力，使二者互相接近；及
 - 一量測裝置，以量測待測物端對端之距離者。
2. 如申請專利範圍第1項所述之端對端量測裝置，其中該平面端探頭與該滑台呈精密滑動靜配合。
3. 如申請專利範圍第1項或第2項所述之端對端量測裝置，其中當旋轉該平面

- 端探頭，可調整其與該圓柱砧面探頭之平行度。
4. 如申請專利範圍第1項所述之端對端量測裝置，其中之量測裝置為選自光學式干涉儀、光學尺或線性電壓微分轉換器(VLDT)者。
5. 如申請專利範圍第1項或第4項所述之端對端量測裝置，其中之量測裝置為光學式干涉儀，且其軸線與待測物量測軸為同軸者。
6. 如申請專利範圍第1項或第4項所述之端對端量測裝置，其中之施力裝置包括一組施力砝碼、一滑輪，以及一連接該砝碼與該滑台之傳力線。
15. 圖示簡單說明：
第一圖表示本創作光學干涉式端對端量測儀實施例之組合示意圖。

(2)



第一圖